

DF40SC3L

30V 40A

特長

- SMD
- 低 $V_F=0.45V$
- PRRSMアバランシエ保証
- 小型大電流量

Feature

- SMD
- Low $V_F=0.45V$
- PRRSM Rating
- High I_o Rating・Small-PKG

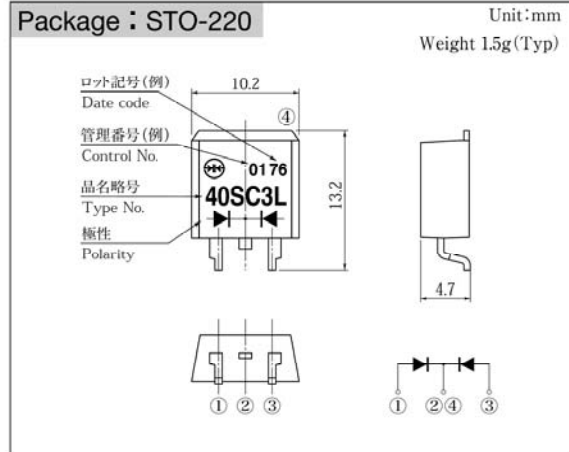
用途

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- 家電、ゲーム、OA機器
- 通信、ポータブル機器

Main Use

- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

■外観図 OUTLINE



■定格表 RATINGS

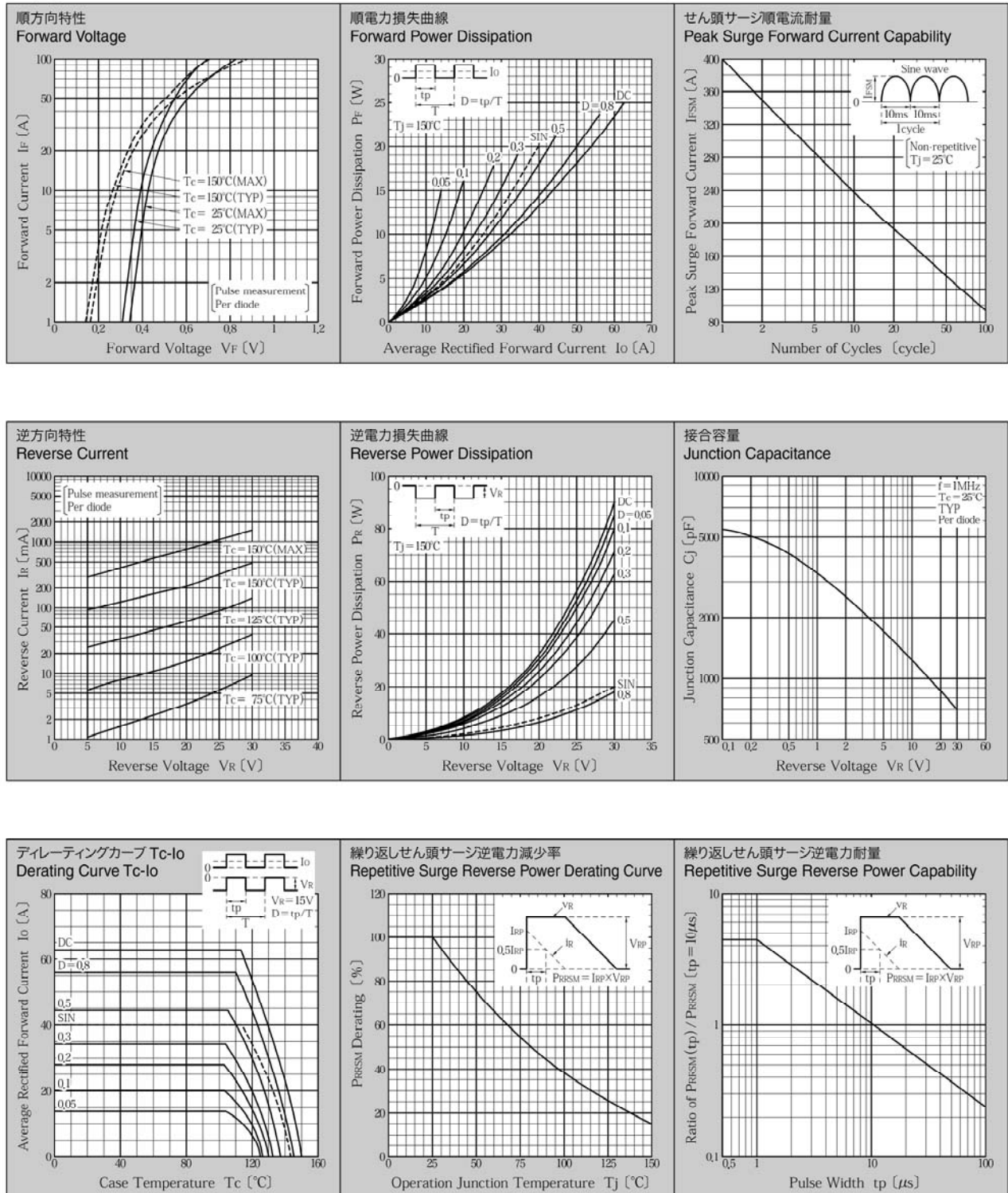
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ C$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF40SC3L	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-55~150	$^\circ C$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ C$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			30	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V_{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		35	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値 $I_o/2$, $T_c = 112^\circ C$ 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode $I_o/2$, $T_c = 112^\circ C$		40	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ C$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ C$		400	A
繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power	P_{RRSM}	パルス幅10 μs , 1素子当り, $T_j = 25^\circ C$ Pulse width 10 μs , Per diode, $T_j = 25^\circ C$		1000	W

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ C$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Per diode	単位 Unit
順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 15 A$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.45	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 17	mA
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f = 1 MHz$, $V_R = 10 V$, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 1200	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 1.5	$^\circ C/W$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical is a statistical average of the device's ability.
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.